

Údaje z profesijného životopisu uchádzača konania na vymenovanie profesora		
1.	Meno, priezvisko, rodné priezvisko	Jarmila Müllerová, rod. Kufčáková
2.	Akademické tituly, vedecko-pedagogické tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké hodnosti	doc. RNDr. PhD.
3.	Rok narodenia	1956
4.	Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom akademickom raste a absolvovanom ďalšom vzdelávaní	<p>2003 habilitácia v odbore Fyzika kondenzovaných látok a akustika na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, hodnosť docent od 1. 3. 2004</p> <p>1988 CSc. – kandidát fyzikálno –matematických vied, odbor kvantová elektronika a optika na MFF UK Bratislava, oprávnenie používať titul PhD. uznané Univerzitou Komenského v r.2002</p> <p>1981 rigorózna skúška (RNDr.), odbor fyzikálna elektronika a optika - nelineárna a koherenčná optika na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK Bratislava</p> <p>1975 – 1980 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor fyzika, špecializácia experimentálna fyzika – fyzika plazmy a rádiofyzika</p> <p>1990 všeobecná štátna jazyková skúška z anglického jazyka na Jazykovej škole pri Gymnáziu M.M.Hodžu v Lipt. Mikuláši</p>
5.	Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu pedagogickej činnosti	<p>1. 3. 2003 – doteraz Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, Detašované pracovisko Liptovský Mikuláš, od 1.4.2012 Inštitút Aurela Stodolu</p> <p>od 1. 7. 2012 riaditeľka Inštitútu Aurela Stodolu, vzdelávacieho a vedecko-výskumného pracoviska EF ŽU so sídlom v Liptovskom Mikuláši</p> <p>2008 – 2012 poverená zastupovaním dekana EF ŽU na Detašovanom pracovisku EF ŽU v Liptovskom Mikuláši</p> <p>2008 – 2012 vedúca Katedry základov inžinierstva EF ŽU</p> <p>2007 – poverená vedením Katedry základov inžinierstva EF ŽU</p> <p>od 1.3.2013 - funkčné miesto profesor</p> <p>1. 9. 2004 – 28.2. 2013 – funkčné miesto docent</p> <p>2003 – 2004 odborná asistentka</p> <p>1993 – 2003 Katedra fyziky, Fakulta logistiky, Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš, pozícia: odborná asistentka, pozícia: 2000 – 2002 poverená vedením skupiny všeobecnej fyziky, pozícia: 2002 – 2003 vedúca skupiny všeobecnej fyziky</p> <p>1983 – 1993 Katedra mikroelektroniky a laserovej techniky, od r.1990 premenovaná na Katedru optoelektroniky, VVTŠ Liptovský Mikuláš, pozícia: odborná asistentka</p> <p>1980 – 1983 Katedra experimentálnej fyziky, Matematicko – fyzikálna fakulta UK, Bratislava, pozícia: interná ašpirantka</p>
6.	Údaje o odbornom alebo umeleckom zameraní	optika, optické vlastnosti objemových materiálov, tenkých vrstiev a tenkovrstvových štruktúr, výskum optických prvkov pre fyzickú vrstvu optických sietí
7.	Údaje o publikačnej činnosti	<p>Monografia:</p> <p>Müllerová, J.: Spektrofotometria tenkých vrstiev. Vydala Slovenská elektrotechnická spoločnosť, Pobočka pri Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Liptovský Mikuláš 2004, 3,42 AH, ISBN 80-968711-7-X Percentuálny podiel: 100 %, Kód publikácie: AAB</p> <p>Učebnica:</p> <p>Müllerová, J.: Využitie maticových metód v optike. EDIS – vydavateľstvo ŽU v Žiline. 2013. Vydala Žilinská univerzita v Žiline/EDIS – vydavateľstvo ŽU, ISBN 978-80-554-0765-4. AH 7,56. Percentuálny podiel 100 %.</p>

		<p>Skriptá:</p> <p>Kučerová, A., Müllerová, J.: Fyzika v príkladoch. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2002. 164 s. 44 obr., 11 tab. Lit..15 zázn. ISBN 80–8040–183–7</p> <p>Šutta, P., Müllerová, J.: Fyzika 1. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2001. 2 zv. 258 s. 151 obr., 1 tab. Lit. 29 zázn. 1: Mechanika, 2: Elektrina a magnetizmus, ISBN 80-8040-166-7</p>
8.	Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu	<p>Citácie: 112, z toho 98 zahraničných (62 SCI), Hirschov index =5</p> <p>Pozvané prednášky na medzinárodných konferenciách:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Determination of parameters and thickness of thin films deposited on absorbing substrates using their reflection spectra. In: 2nd Workshop Solid State Surfaces and Interfaces II. SSSI-II, June 20-22, 2000, Bratislava 2. Extraction of Optical Parameters of Thin Films from Spectral Measurements for Design and Optical Performance of Multilayer Structures. In: 3rd Workshop SSSI Solid State Surfaces and Interfaces III, November 19 – 21, 2002, Smolenice 3. Structural and optical studies of Si thin films: from amorphous to nanocrystalline silicon. 4th International Workshop on Solid State Surfaces and Interfaces SSSI 2004, November 8 – 11, 2004, Smolenice 4. Optical characterization of polysilicon thin films for solar applications. International Conference Solar Renewable Energy News SREN 2005, Firenze, Italy, 7th April 2005 5. Characterization of the Amorphous to Polycrystalline Transition with Nano-size Grains in PECVD Growth of Si:H - Optical and Structural Properties. 1st International Workshop Semiconductor Nanocrystals SEMINANO 2005, Budapest, Hungary/11th September 2005 6. On the role of hydrogen in microstructure of hydrogenated silicon thin films. 5th International Workshop on Solid State Surfaces and Interfaces SSSI 2006, November 19 – 23, 2006, Smolenice 7. Microstructure related optical characterization of thin films for solar applications. 16th Polish-Czech-Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, Polanica Zdrój, Poland 8. – 12. 9. 2008 8. Super-separation thin film filtering for coexistence-type colorless WDM-PON networks. 13th International Conference on Transparent Optical Networks ICTON 2011, Stockholm, Švédsko, 27. – 30. jún 2011 9. Optika tenkých vrstiev z pohľadu skúmania ich mikroštruktúry. 17. konferencia slovenských a českých fyzikov, Žilina, 5. – 8. 9. 2011 10. On wavelength blocking for XG-PON coexistence with GPON and WDM-PON networks. ICTON 2012 14th international conference on transparent optical networks 2 - 5 July, 2012, University of Warwick, Coventry, UK 11. Steep optical filtering for next generation optical access networks. 18th Czech-Polish-Slovak optical conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics September 3-7, 2012 Ostravice, Czech Republic. Olomouc, Palacky university, 2012. 12. Wavelength protection within coexistence of current and next-generation PON networks. 15th ICTON

		International Conference on Transparent Optical Networks, 23 – 27 June 2013, Cartagena, Spain Členstvo vo vedeckých výboroch medzinárodných konferencií: 23
9.	Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili	3 (Ing. Libor Ladányi, denná forma, od 1.9.2011, po dizertačnej skúške, Ing. Dušan Korček, externá forma, od 1.9.2009, po dizertačnej skúške, Ing. Ľubomír Scholtz, (denná forma, od 1.9.2013) 2 (Ing. Erik Gemzický - obhajoba 2010, Mgr. Eliška Jurisová - obhajoba 2012)
10.	Názov študijného odboru, v ktorom sa konanie uskutočňuje	Elektrotechnológie a materiály
11.	Téma inauguračnej prednášky	Pokročilé materiály pre fotoniku a diagnostika ich vlastností